

本カタログの掲載内容に関するお問い合わせは、下記窓口にて承っております。

Denkei
日本電計株式会社

ソリューション推進部
Email. sl-rikagaku@n-denkei.co.jp Tel. (03) 5807-1881

本社 〒110-0005 東京都台東区上野5-14-12 NDビル7階
Email. (03) 5816-3551 (代表) Fax. (03) 5816-3550



拠点一覧

- | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 仙台営業所代表 | sendai@n-denkei.co.jp | 長野営業所代表 | nagano@n-denkei.co.jp |
| 秋田サテライト | sendai@n-denkei.co.jp | 松本営業所代表 | matumoto@n-denkei.co.jp |
| 郡山営業所代表 | koriyama@n-denkei.co.jp | 山梨営業所代表 | yamanasi@n-denkei.co.jp |
| 宇都宮営業所代表 | utonomiy@n-denkei.co.jp | 金沢営業所代表 | kanazawa@n-denkei.co.jp |
| ひたちなか営業所代表 | hitachinaka@n-denkei.co.jp | 三島営業所代表 | mishima@n-denkei.co.jp |
| 茨城営業所代表 | ibaraki@n-denkei.co.jp | 浜松営業所代表 | hamamatu@n-denkei.co.jp |
| 群馬営業所代表 | gunma@n-denkei.co.jp | 名古屋営業所代表 | nagoya@n-denkei.co.jp |
| 埼玉営業所代表 | saitama@n-denkei.co.jp | 刈谷営業所代表 | kariya@n-denkei.co.jp |
| 千葉営業所代表 | chiba@n-denkei.co.jp | 三重営業所代表 | mie@n-denkei.co.jp |
| 東京営業所代表1課 | tokyo-i@n-denkei.co.jp | 滋賀営業所代表 | shiga@n-denkei.co.jp |
| 東京営業所代表2課 | tokyo-w@n-denkei.co.jp | 京都営業所代表 | kyoto@n-denkei.co.jp |
| 東京南営業所代表 | minami@n-denkei.co.jp | 大阪営業所代表 | osaka@n-denkei.co.jp |
| 東京西営業所代表 | tokyonishi@n-denkei.co.jp | 兵庫営業所代表 | hyogo@n-denkei.co.jp |
| 多摩営業所代表 | tama@n-denkei.co.jp | 岡山営業所代表 | okayama@n-denkei.co.jp |
| 川崎営業所代表 | kawasaki@n-denkei.co.jp | 広島営業所代表 | hiroshima@n-denkei.co.jp |
| 横浜営業所代表 | yokohama@n-denkei.co.jp | 福岡営業所代表 | fukuoka@n-denkei.co.jp |
| 厚木営業所代表 | atsugi@n-denkei.co.jp | 大分サテライト | fukuoka@n-denkei.co.jp |
| 湘南営業所代表 | shounan@n-denkei.co.jp | 熊本営業所代表 | kumamoto@n-denkei.co.jp |
| 長岡営業所代表 | nagaoka@n-denkei.co.jp | 鹿児島営業所代表 | kagoshima@n-denkei.co.jp |

理化学・環境試験 製品ダイジェストカタログ

Physics and Chemistry

Denkei

INDEX

01 観察装置

グリーノ実体顕微鏡	基板/電子部品	3
ハイブリッドレーザーマイクロスコープ	半導体/電子部品/素材/電池	
デジタルマイクロスコープ	基板/電子部品	
デジタルマイクロスコープ	基板/電子部品/自動車/電池	
卓上SEM(走査型電子顕微鏡)	半導体/電子部品/素材/電池	
SEM(走査型電子顕微鏡)	半導体/電子部品/素材/電池	
SPM(走査型プローブ顕微鏡)	半導体/電子部品/素材/電池	
卓上型X線装置	電子部品	
マルチフォーカスX線検査装置	基板/電子部品/自動車/電池	
マイクロフォーカスX線CT	自動車/電池	4
3Dレーザー顕微鏡	半導体/電子部品/素材/電池	
ナノ3D光干渉計測システム	半導体/電子部品/電池	
工業用計測機能付き内視鏡	自動車	
ハイパワースペクトルカメラ	素材/電池	

02 分析装置

紫外可視近赤外分光光度計	自動車/素材	
フーリエ変換赤外線分光装置	半導体/電子部品/素材/電池	
顕微FT-IR	半導体/電子部品/素材/電池	
レーザーラマン顕微鏡	素材/電池	
ミニラマンセンサー	自動車/素材/電池	5
示差熱重量同時測定装置	素材/電池	
ハンドヘルド蛍光X線分析計	基板/電子部品/素材/リサイクル	
蛍光X線分析装置	基板/電子部品/素材	
微小部蛍光X線分析装置	素材/基板	
固体発光分光分析装置	半導体/電子部品/電池	
ICP発光分光分析装置	半導体/電子部品/電池	
電気化学測定システム	素材/電池	

03 光学測定装置

光コム三次元センサー	半導体/電池/自動車	
熱伝導測定装置	半導体/素材	6
ラマン分光複合システム	素材/電池	
ガスクロマトグラフ質量分析計	半導体/電子部品/素材/電池	

04 物性測定装置

自動接触角計	素材	
はんだ濡れ性試験機	基板/素材	
マイクロピッカース試験機	自動車/素材	
超音波膜厚さ計	自動車	
磁気式厚さ計	自動車/素材/建材	
蛍光X線膜厚計	半導体/自動車	

05 環境装置

オープンクリーンシステム	半導体/電子部品/素材/電池	7
オープンスーパークリーンルーム	半導体/電子部品/素材/電池	
キセノン耐候性試験機	自動車/建材	
超促進耐候性試験機	自動車/建材	
超促進耐候性試験機	自動車/建材	
複合サイクル腐食試験機	自動車/建材	
超音波カメラ	自動車/半導体/電子部品	

06 処理装置

試料前処理装置	電子部品/自動車	
攪拌・脱泡装置	素材	8
断面試料作製装置	半導体/電子部品	
卓上精密切断機	基板/電子部品/自動車	
試料研磨装置	基板/電子部品/自動車	
3Dプリンター	自動車	
3Dスキャナー	自動車	

観察装置

レーザーテック

ハイブリッドレーザーマイクロスコープ OPTELICS HYBRID+

高分解能観察トレーサビリティの取れた 3D 形状測定

白色光 / レーザーのハイブリッド光学系
広いエリアを高精度に測定する
白色干渉、位相シフト干渉観察
ナノレベルの薄膜を測定する
反射分光観察にて膜ムラ表示が可能
微分干渉観察を用いた欠陥検査
業界最高の測定精度にて自動計測が可能



ハイロックス

デジタルマイクロスコープ HRX-01

操作性、臨場感、正確さ。テレセントリックレンズ搭載可

- 高解像度で鮮明に映し出す大口径レンズ
- ひずみを徹底的に抑えたテレセントリックレンズ
- 圧倒的な操作性を実現した電動制御レンズ
- 広視野高精細ワンショット撮影可能
- 【3D 計測】【画像連結】の中から必要な機能を選択して導入可能
必要なときに進化できます



日本電子

SEM(走査型電子顕微鏡) JSM-IT510

必要なデータを、いつだってシンプルに

- 新機能 Simple SEM 撮影したい視野を選ぶだけで連続撮影可能
- Zeromag 光学像を拡大すれば SEM 像
- Live Analysis (EDS : オプション)
観察しながら、目的元素を探せます
- 分解能 高真空 : 3nm、低真空 : 4nm
- 最大試料 200mmφ × 75mm
- 低真空ハイブリッド二次電子検出器 (LHSED)
低真空でも凹凸情報が得られます (オプション)



メディエックステック

卓上型 X 線装置 MX-80eco

低価格で導入、省スペース卓上型 X 線検査装置

- 電子部品 / 半導体部品 / ケーブルなどの内部構造の非破壊検査
- 卓上型で省スペース。低価格
- 簡単な操作性。画像処理ソフト標準装備
- 設置が簡単。安全設計
- 寸法 :
(W)504mm × (D)630mm × (H)510mm



ライカマイクロシステムズ

グリーンノ実体顕微鏡 Ivesta 3

アポクロマートレンズ搭載、9倍ズームを実現

- 目視専用モデル。良好な色再現性、リアルな質感。
- 4 K カメラ内蔵モデルモニター、モバイルデバイス、パソコンなど、様々なデバイスでデジタル画像を直接共有
- C マウント付きモデル必要に応じてカメラを追加し、デジタルソリューションに拡張可能
- 深い焦点深度 12mm、超広視野 37.6mm



ライカマイクロシステムズ

デジタルマイクロスコープ Emspira 3

外観検査をシンプルに使いやすさを追及

- PC レスでライブ観察 / 計測 / データ保存が可能
- レンズ・照明 / スタンド / ソフトなどの組み合わせが自由
- 高速 4K 高精細のライブ画像 (最大 60fps)
- PC 解析ソフトも充実
- 本体は防塵防水加工が施され (IP21) 表面の AgTreat による抗菌加工で細菌の拡散を防ぎます



日本電子

卓上 SEM(走査型電子顕微鏡) JCM-7000

SEM 観察、元素分析 簡便な操作性の卓上 SEM

- Zeromag 機能 : CCD 画像 (色情報) と SEM 像 (表面詳細情報) が連動、素早く快適な視野探しが可能
- 2 軸モーターステージ (X、Y) 標準搭載
- Live Analysis 機能 (EDS オプション時) :
観察中も常に元素分析が可能
- Live 3D 機能 :
その場で凹凸 / 深さ情報の取得が可能



日立ハイテク

SPM(走査型プローブ顕微鏡) AFM1000Plus/AFM 100

操作性と信頼性、スループットの向上を追求

- AFM 装置の普及を目的とした小型高分解能 AFM ユニット
- 基本機能 : AFM、DFM、PM、FFM、SIS-形状
AFM100Plus は SIS-物性、Q 値制御も
- オートパイロット自動測定機能による
ワンクリック測定解析
- ブリマウント方式カンチレバー (オプション)
- AFM マーキング → 同一視野の SEM 評価可能



コメットテクノロジー

マルチフォーカス X 線検査装置 Cheetah EVO

最高の X 線画像をスピーディに生成

- ナノフォーカスモードと高出力モードを
両立したマルチフォーカス X 線管搭載
- 16 ビット (65000 階調) フラットパネル
ディテクタによる抜群の表現力
- オプション : 直交 CT、斜め CT、リフロー
- 電子部品だけでなく、樹脂部品、ゴム部品、
金属部品にも有効



東芝 ITC

マイクロフォーカス X 線 CT TXS-32300FD/33000FD

圧倒的高画質 3D 像、スマートな操作性を実現!

- 新 X 線発生器、新 FPD 採用、高画質化を実現
- マイクロフォーカス X 線発生器
230kV、300kV タイプから選択可能
- スマートモードで誰でも簡単に高画質
- ユーザーインターフェース一新、
さらに簡単に使いやすく
- 電子部品、電池、鋳物製品の検査に

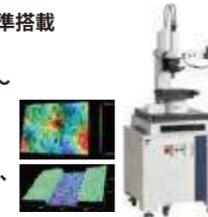


日立ハイテク

ナノ 3 D 光干渉計測システム VS1800

広範囲でナノオーダーの表面形状測定を実現

- 「ISO25178* バラメータ比較ツール」を標準搭載
* 三次元表面粗さの国際規格
- 垂直分解能 0.01nm、面内分解能 350nm ~
- 直感的で使いやすいインターフェース
- 層断面計測も可能
- ウェハパターン、MEMS、フォトレジスト、
ガラス、金属、紙の微小凹凸などに



コニカミノルタ

ハイパワースペクトルカメラ SPECIM シリーズ

見えるものから見えないものまで判別可能

- 可視域~近赤外の分光データを取得可能
- 物性の判別や定量化を実現
- 測定場所を選ばないモバイルタイプ
- 波長域 400 - 1000 nm、900 - 1700 nm、
2.7 - 5.3 nm の 3 機種
- 各種用途に応用可能
(リサイクル、食品、文化財等)



日立ハイテクサイエンス

紫外可視近赤外分光光度計 UH 4150

固体分光測定のエキスパートがさらなる進化

- 検出器切り替え段差が少なく、より正確な測定が可能
- プリズムグレーティングダブルモノクロメータにより、
低迷光、低偏光特性を両立
- 平行光束により、反射光、散乱光もより正確に
- 豊富な検知器をラインアップ
- さらなるハイスループット化を達成
- 人間工学に基づく新デザイン



サーモフィッシャー

顕微 FT-IR Nicolet iN10

初心者からエキスパートまで、安心の操作性!

- 測定中もリアルタイムで可視画像を観察
- スピーディーな分析を実現
- 混合物の分離に便利な自動成分解析、
粒子解析機能
- マルチコート Ge Tip-ATR は
スループット 50% 以上の高感度
- 分析ウィザードで測定、解析、検索まで簡単操作

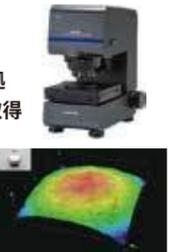


エビデント

3D レーザー顕微鏡 OLS5100

表面 3D 形状の観察と測定を高速に

- 説得力あるデータを、かつてないスピードで
- 非接触粗さの次世代パラメータ ISO25178 に準拠
- スタートボタンを押すだけで全自動 3D データ取得
- 非接触で、ナノに迫る高分解能 3D 観察、測定
- 自動車部品、電子材料、金属組織の
表面の画像撮影、高精度測定
- ISO17025 校正が可能に



エビデント

工業用計測機能付き内視鏡 IPLEX NX

人の目が届かない製品や内部の観察、計測に最適

- 不具合を見逃さない「高画質」
- 様々な検査に対応する『多様なラインアップ』
- 外径φ2.4 mm ~ 8.5 mm、有効長 1.2m ~ 30m
- 4つの検査手法で付加価値提案



分析装置

サーモフィッシャー

フーリエ変換赤外線分光装置 Nicolet Summit

コンパクト、高性能、接続性の高い FT-IR

- LightDrive オプティカルエンジン搭載
一定のエネルギー強度とスポット位置
- ビルトインコンピューター
PC なしでも操作・解析可能
- 赤外光源 / レーザー / 干渉計 安心の 10 年保証
- 品質管理や研究に
- 異物分析を現場で (繊維 / オイルの混入)



ナノフォトン

レーザーラマン顕微鏡 RAMANtouch

超高速ラマンイメージング!

- 1 回の照射で 400 本のラマンスペクトルを測定
- 数万画素のイメージングを数分で取得
- 回折限界に迫る 350nm の空間分解能
- 電池材料、ポリマー、炭素材料、
シリコン、成型薬剤の解析に
- オプションに紫外レーザーが登場



メタセンシング

ミニラマンセンサー Raman EYE シリーズ

お手持ちの金属顕微鏡に取付けるだけでラマン顕微鏡に

- ・プロセスラマンにも活用可能なハイブリッド方式、プローブを用いた計測で PAT に対応
- ・お手持ちの顕微鏡にわずか 1 分で簡単装着
- ・顕微鏡の改造不要



エビデント

ハンドヘルド蛍光 X 線分析計 VANTA Element-S

その場で素早く非破壊で、成分元素を分析！

- ・6 メソッドを標準搭載したマルチパーパスモデル Alloy (合金)、Coating (めっき厚)、PM (貴金属)、RoHS (有害物質)、Geochem (無機材料)、Soil (土壌)
- ・Mg への軽元素測定対応
- ・50kV Ag 管、SDD 検出器搭載
- ・原材料 / 製品 / リサイクル品に、大きな試料もそのまま



ブルカージャパン

微小部蛍光 X 線分析装置 TORNADO M4

非破壊、非接触、あらゆる試料の元素マッピング分析

- ・C から Am まで元素を測定
- ・微小部の測定に最適なポリキャピラリー光学系
- ・大面積シリコンドリフト検出器を搭載
- ・凹凸試料の測定を可能する特許 AMS
- ・前処理不要、試料をステージに載せるだけで、最大 16cm x 19cm の元素マッピングデータが取得できます。



日立ハイテクサイエンス

ICP 発光分光分析装置 PS3500-DD II シリーズ

組成評価・純度評価・排水分析に

- ・試料中の元素を定性・定量する装置
- ・微量分析・精密分析に
- ・シーケンシャル型
波長分解能 世界最高水準の 0.003nm
- ・新開発ハイパーダイレクトドライブ採用
高速・高精度な測定が全スペクトル領域で可能
- ・PS3520UV-DD II は、従来元素に加え、塩素・臭素の測定も可能



日立ハイテクサイエンス

示差熱熱重量同時測定装置 NEXTA STA

比熱容量測定にも対応

- ・デジタル水平作動方式の TG/DSC
業界トップレベルのベースライン安定性
- ・示差走査熱量計 (DSC) で、融点、ガラス転移点など
- ・熱重量 (TG) で、組成比、脱水温度と量など
- ・熱安定性、劣化寿命シミュレーションに
- ・Real View オプションで
1000℃ までの試料観察測定が可能



日立ハイテクサイエンス

蛍光 X 線分析装置 EA シリーズ

有害物質 (RoHS 物質等) を簡単・迅速に分析、窒素レス

- ・検出器は液化窒素不要、ランニングコスト削減
- ・有害物質判定ソフトにより、必要最低限の時間で測定可能です
- ・垂直照射 X 線、ピンポイント分析可能
- EA1000A III 汎用
- EA1400 高感度、軽元素
- EA6000VX 微小部、マッピング分析可能



日立ハイテクサイエンス

固体発光分光分析装置 FM Expert

迅速に固体金属の定性・定量可能

- ・鉄鋼、鋳物鋳造、非鉄金属分析で品質管理が可能
- N (窒素) などの元素が検出できます
- ・高い検出感度で有害元素が検出できます
- ・光ファイバーを使用しない直接測光方式
- ・長寿命で低ランニングコスト
- コンパクトな光学系で Ar ガスで運用
- ・小型でコンパクト。卓上に設置可能



アメテック AMT 事業部

電気化学測定システム ポテンショスタット VersaSTAT

電池、腐食、基礎的電気化学の研究開発に

- ・ポテンショスタットの選択に迷ったら、まずは VersaSTAT 3
- ・プリンストンアプライドリサーチ製
- ・最大電流 2A、最小電流レンジ 200nA
- ・最大電圧 10V
- ・インピーダンス測定周波数 最大 1MHz
- ・FRA オプション追加でインピーダンス測定可
- ・購入後のアップグレードも簡単



OptoComb

光コム三次元センサー OptoComb SL シリーズ

複雑な三次元形状を μm オーダーで高精度に 3D 化

- ・3次元データ化から自動検査まで一気通貫
- ・光コム同軸測定方式により複雑な形状も高速かつ正確に測定
- ・ソフトウェアも充実、外観 / 寸法 / 容積の自動測定が可能
- ・最小 $1\ \mu\text{m}$ (Z 方向) 分解能で高精度に測定
- ・卓上測定からインライン全数検査まで
- ・A I にも対応し自動検査を向上
- ・お客様の課題やご予算に応じてご提案



アドバンス理工

熱伝導測定装置 TD-1 シリーズ

放熱材の開発で脱炭素社会に貢献

- ・高分子フィルム、磁性材、接着剤、パワーデバイス、塗料、その他高分子等、様々な分野へ適用
- ・卓上設置型で省スペース
- ・室温 ~ 最高 350℃ までの温度制御が可能
- ・多層解析ソフトによる多層材の熱拡散率評価
- ・オプションによる異方性評価



日本電子

ガスクロマトグラフ質量分析計 JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta

第 6 世代のハイエンド GC-QMS

- ・高い感度と圧倒的なダイナミックレンジ
- ・高性能 EI イオン源で高感度化達成
- ・統合定性解析ソフトウェアにて定性解析を実現



協和界面科学

自動接触角計 DMO-502

表面と液の濡れ性評価に

- 静的 / 動的濡れ性評価
- 滑落する液体の評価
- 表面自由エネルギー測定
- 液出、接触角測定とも自動
- 車、電池材料、医薬、食品、各種工業品の「ぬれ」の評価に



イノバテスト

マイクロビッカース試験機 FALCON シリーズ

広範囲の試験力を 1 台で実現したビッカース複合機

- ・ロードセル使用の完全デジタル硬度計
- ・6 ターレットポジション、ターレット衝突検知 / ワーク後退安全装置付帯
- ・HD フルカラーステージオーバービューカメラ、光学ズーム機能搭載
- ・顕微鏡機能 (粒度解析) をオプションで可能
- ・検査結果はデータで取り出し可能



エビデント

磁気式厚さ計 Magna-Mike 8600

検査工程の省力化と品質管理をサポートに貢献

- ・非磁性材料の肉厚を高精度に測定
⇒プラスチック製、ガラス製のボトル、容器など
- ・0.001mm から 25.4mm までの肉厚を測定可能
- ・英数字データロガーを内蔵し、測定値を簡単に保存・転送



サーモフィッシャー

ラマン分光複合システム DXR3Flex

初心者からエキスパートまで安心の操作性！独自の機能

- ・測定中もリアルタイムで可視画像を観察
- ・スピーディーな分析を実現
- ・混合物の分離に便利な自動成分解析、粒子解析機能
- ・マルチコート Ge Tip-ATR はスルーブット 50% 以上の高感度
- ・分析ウィザードで測定、解析、検索まで簡単操作



物性測定装置

レスカ

はんだ濡れ性試験機 5200TN

はんだ、フラックスと電子部品との濡れ性評価に

- ・はんだ槽平衡法
溶融はんだ内に電子部品を浸漬、固体に生じる上下方向の力の時間軸変化で評価
- ・常温 ~ 400℃
- ・測定レンジ: $\pm 10\text{mN}$ 、50mN
- ・オプションで、はんだ小球平衡法、急加熱昇温法、プロファイル昇温法も可能



エビデント

超音波膜厚さ計 72DL PLUS

数十ミクロンの極薄材測定に対応

- ・プローブを片側から当てるだけで簡単に再現性高い測定が可能
- ・高周波による極薄材の厚さ測定: 多層の塗装、プラスチック、金属、コーティングなど
- ・多層材やコーティングの各層測定: 最大 6 層までの各層の厚さ + 選んだ複数の層の合計をリアルタイム測定
- ・産業環境向けの設計: IP65 相当の防塵防滴性能、落下試験 (MIL-STD-810G) に合格など
- ・インライン対応



日立ハイテクサイエンス

蛍光 X 線膜厚計 FT110 A

めっき厚測定に、さらに進化した X 線膜厚計

- ・オートフォーカス、オートアプローチ
高低差 80mm 以内なら
3 秒以内に自動焦点合わせ
- ・微小ビームの高感度化、測定時間短縮
- ・広域観察像から観察位置指定可能
- ・コーメータ 4 種
($\phi 0.05\text{mm}$ 、 $\phi 0.1\text{mm}$ 、 $\phi 0.2\text{mm}$ 、 $0.025 \times 0.4\text{mm}$)



光学測定装置

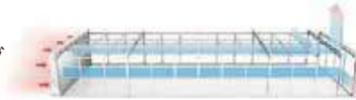
環境装置

興研

オープンスーパークリーンルーム フローコーチEz

ISO クラス 1 の清浄度 長さ 20m まで可能

- ・フローコーチ (1台 W1050×H850mm) とガイドスクリーン、対向する衝突壁を組合せ、広い空間を低コスト、短時間でスーパークリーン化可能
- ・建設コストが抑えられ、工期も短時間で済みます
- ・低消費電力で、ランニングコストが抑えられます



岩崎電気

超促進耐候性試験機 アイスーパー UV テスター-SUV-W171

促進倍率は太陽光の約 100 倍

- ・有効照射面積は幅 480 mm × 奥行 200 mm で弊社従来比約 20% 拡大
- ・メタルハライドランプ方式。紫外線照度最大 150mW/cm² でスピーディーな耐候性試験を実現
- ・コネクト方式で容易なランプ交換
- ・環境に配慮し省電力化を実現
- ・紫外線+可視光フィルタ (オプション) で JIS A 1501 に対応



ascott

複合サイクル腐食試験機 CC450,1000,2000

国際的に高い評価を受けている Ascott Analytical 製品

- ・4つの独立した異なった試験環境可能
 1. 塩水噴霧、2. 湿潤、3. 空気乾燥、4. 湿度制御
- ・出し入れしやすい低い取り出し口
- ・耐久性のある噴霧ノズル、安定噴霧可能
- ・国内外の様々な規格に対応
- ・自動車部品、屋外使用機器の試験に最適



処理装置

興研

オープンクリーンシステム テーブルコーチ T500-F

囲うことなく、ISO クラス 1 の清浄度を実現!

- ・半導体、精密部品取扱い、シール貼り合わせ、秤量に
- ・両側からのプッシュ気流でクリーン空間を作ります
- ・清浄度: ISO クラス 1 (0.1 μm 以上 < 10 個 / m²)
- ・全換気時間: 110 秒
- ・開口面: W494×H306mm
- ・清浄空間: 700mm 以内
- ・卓上型、持ち運べます (14kg/台)



Q-Lab

キセノン耐候性試験機 Q-SUN

紫外～可視～赤外、全波長の太陽光をほぼ再現

- ・空冷式、ランニングコストが抑えられます
- ・Q-SUN 試験機保有の照度センサーで迅速な校正可能
- ・長寿命の光学フィルター (半永久的使用可能)
- ・ランプ出力を常にモニタし制御、再現性に優れた光暴露可能
- ・Xe-1、Xe-3: 平面トレイ、様々な試験片サイズ、形状に対応
- ・Xe-2: 大容量の回転ラック、46mm×122mm の試験片 31 枚



岩崎電気

超促進耐候性試験機 アイスーパーキセノンテスター XER-W85

国内外の各種規格に対応

- ・設置スペース約 28% 削減 (弊社従来比) のコンパクトモデル
- ・促進耐候性試験機の中で太陽光の分光スペクトルに最も近似したキセノンランプ方式
- ・シャワー、暗黒サイクルも可能
- ・環境に配慮し省電力化を実現
- ・強照度試験 (60 ~ 180W/m²) 54 枚試験可能



フルーク

超音波カメラ ii900

工場内のエアリー漏れをモニターで可視化!

- ・エアリー漏れを発見し省エネルギーを実現します
- ・可視カメラを中心に 64 個の MEMS マイクを装備
- ・音響画像と可視画像の重ね合わせ 2-52kHz の超音波を検出
- ・調整可能な周波数レンジ
- ・ii900: エアリー漏れ / コロナ放電を可視化
- ・ii910: エアリー漏れ / コロナ放電 / ガス漏れ / 真空漏れを可視化



バルメン

試料前処理装置 PERET

微粒子投射技術による超低角度斜め研磨&浮彫り研磨

- ・0 ~ 1 度の超低角度斜め研磨
- ・簡単な操作でナノオーダーの精密研磨
- ・樹脂・ゴムでも変質させずに精密研磨
- ・最小研磨量をナノオーダーで調整
- ・□2mm の加工で広いエリアを観察
- ・ワークの形状を問わずに表面から加工



写真化学

攪拌・脱泡装置 カクハンター SK-350T II

スラリーの攪拌・脱泡を同時に

- ・公転と自転の回転速度を個別に設定できます → 幅広い材料の攪拌脱泡を実現
- ・粉と液材など、比重差のある材料の混合も可能
- ・条件設定メモリ 100ch、ステップモードも可能
- ・400mL 容器 × 2 カップ
- ・公転: 9 段階設定
- ・自転: 公転に対して 10 段階設定

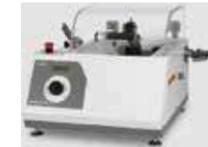


ハルツォク・ジャパン

卓上精密切断機 ミクラカットシリーズ

観察・分析前処理に、精密な切断ができます

- ・光学顕微鏡、電子顕微鏡観察前処理に好適
- ・ミクラカット 152 は取扱いが簡単なバランスウェイト方式の精密切断機
- ・最大切断試料: 50mm
- ・ミクラカット 202 は、手動切断の他、自動送りテーブルによる自動切断も可能
- ・最大切断試料: 75mm



日本 3D プリンター

3D プリンター Raise3D Pro3

低価格高精度 3D プリンター

- Pro シリーズの最高峰となる最新機種。高いユーザビリティ
- ・軽量かつ重心最適化されたダイレクト方式エクストルーダー
- ・高剛性なフルメタルフレームと Z 軸ロッド
- ・平面内の温度差が少なく、反りを最小に抑えるヒートベッド
- ・多様なサードパーティ製フィラメントが使用可能。最適な材料を選択可能



日本電子

断面試料作製装置 クロスセクションポリシャ

SEM、EPMA、オージェの分析前処理に

- ・Ar イオンビームと遮蔽板で断面加工、微細な構造の観察や元素分布分析に
- ・広い領域 (500 μm 以上) で凹凸の少ない加工面
- ・機能ホルダの選択で断面ミリングの他、断面ミリング、スパッタコーティングも可能
- ・新開発のイオンソース (オプション) を付けければ断面ミリングレート 2.4 倍に



ハルツォク・ジャパン

試料研磨装置 FORCIPOL-102

観察試料作製に、粗研磨から鏡面研磨まで

- ・金属、セラミックス、ガラスなどの研磨に
- ・研磨盤 200mmφ、250mmφ、300mmφ
- ・回転数 50-600rpm 可変
- ・フォーシマット (荷重回転機) を付ければ自動研磨装置になります
- ・フォーシボル 102 + フォーシマット 102



日本 3D プリンター

3D スキャナー EinScan HX

計測グレードの高精度なスキャニングが可能

- ・正確で精度の高いスキャニング
- ・複数のレーザーモードを搭載
- ・フォトグラメトリー機能を統合
- ・検査ソフトやデザインソフトとの連携



ONLINE EXHIBITION



keisokuten.jp

- 電子計測機器展
- 試験機器展
- 自動車テクノロジー展
- 科学・分析機器展
- 二次電池テクノロジー展
- EMC・ノイズ対策技術展
- 画像・センシング展
- ソフトウェア展
- 太陽電池テクノロジー展
- ディスプレイテクノロジー展
- 省エネ計測展

計測技術で社会に貢献

トータルソリューション

柔軟なシステムコーディネート
高度なエンジニアリング力
シームレス体制による一元化



企業情報

Denkei

二次電池充放電装置

二次電池の研究開発に欠かせない充放電装置。知識と経験が豊富な専門チームが最適なシステムを提案します。研究開発や製造工程で利用する各種試験装置を国内外から調達からシステムコーディネート、そして装置の導入までをトータルサポートします。

理化学分析・環境試験機器

専門知識を持ったテクニカルアドバイザーがお客様のニーズに合わせた提案します。国内外の最新の規格、規制や市場動向など、全方向のアンテナを持ち、最適な製品の提案から試験機の設置・保守までを一貫して対応します。また、販売・レンタルだけでなく、各種受託試験の紹介も可能です。

EMC関連機器・設備

電波暗室・建屋の建築設計条件提示、レイアウト設計、試験規格や試験方法のコンサルティングから仕様提案、現場管理、保守サービスに至るまで、EMCのトータルソリューションを提供します。お客様のニーズに合わせて、暗室メーカー、システムインテグレータ、計測メーカーを取り纏め、シームレスな体制を構築します。